PAT-NO:

JP410282520A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10282520 A

TITLE:

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUBN-DATE:

October 23, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KASAI, TSUTOMU INOUE, HIROYUKI YAMAMOTO, HIDEAKI KANEKO, TOSHITERU AMANO, SATOSHI TAKANO, TAKAO OHARA, KAZUHIRO SHIMAKURA, YOSHITAKA HIDA, HIROYUKI ANJO, KENJI ARIYOSHI, TOMOYUKI AIDA, TAKAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

HORII, JUICHI

N/A

APPL-NO:

JP09084798

APPL-DATE: April 3, 1997

INT-CL (IPC): G02F001/136, G02F001/1343 , H01L029/786 ,

H01L021/336

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liquid crystal display which is formed with tapers at signal lines in spite of extremely simple stages by providing

the device with signal lines formed with laminated films composed of alloy

films consisting of Cr or essentially consisting of this Cr and ITO films.

SOLUTION: Video signal lines, drain electrodes 3D and source electrodes 3S

comprise the laminated films formed by successively laminating the alloy films

3b of the Cr and Mo and ITO films 3b. In such a case, the video signal lines,

drain electrodes 3D and source electrodes 3S may be formed with the prescribed

patterns merely by using an etchant for the alloy film 3b of the Cr and Mo as

the etchant. Namely, there is no need for respectively successively using the

etchant for the ITO films 3b and the respective etchants for the alloy films 3b

of the Cr and the Mo. Since the selective etching of the laminated films is

executed while the ITO films 3b retreat, the breakage in the difference-

in-level parts of pixel electrodes 8 riding over the source electrodes 3D

consisting of the laminated films via protective films 7 may be prevented.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-282520

(43)公開日 平成10年(1998)10月23日

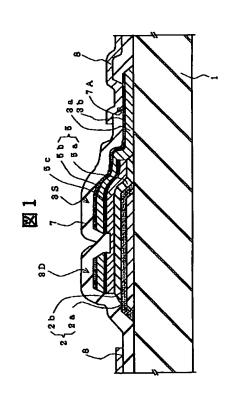
(51) Int.CL.*		識別記号		ΡI					
G02F	1/136	500		G 0	2 F	1/136		500	
	1/1343					1/1343			
H01L	29/786			H0	1L 2	29/78		612Z	
	21/336							616K	
								616U	
			審査請求	未譜求	朝求	質の数 3	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号		特顧平9-84798		(71)	出質人	00000	5108		-
						株式会	社日立	製作所	
(22)出顧日		平成9年(1997)4月3日				東京都	F 代田	区神田駿河台	四丁目6番地
				(72)	発明者	笠井	勉		
						千葉県	技原市	早野3300番地	株式会社日立
						製作疗	電子デ	パイス事業部	内
				(72)	発明者	. 井上	博之		
						千葉項	戊原市	早野3300番地	株式会社日立
						製作的	電子デ	パイス事業部	内
				(72)	発明者	山本	英明		
				}		千葉県	茂原市	早野3300番地	株式会社日立
							. –	パイス事業部	内
				(74)	代理人	. 弁理士	* 秋田	収審	
									最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 被晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 信号線として適当な材料を選択できるとも に、極めて工程が簡単にも拘らず該信号線にテーパが形 成されたものを得る。

【解決手段】 液晶を介して互いに対向配置される透明 基板のうち少なくともその一方の透明基板の液晶側の面 に、各画素を駆動させるための信号線が形成されている 液晶表示装置において、CrあるいはCrを主成分とす る合金膜とITO膜との積層膜で形成された信号線が備 えられている。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶を介して互いに対向配置される透明 基板のうち少なくともその一方の透明基板の液晶側の面 に、各画素を駆動させるための信号線が形成されている 液晶表示装置において、

CrあるいはCrを主成分とする合金膜とITO膜との 積層膜で形成された信号線が備えられていることを特徴 とする液晶表示装置。

【請求項2】 液晶を介して互いに対向配置される透明 基板のうち一方の透明基板の液晶側の面に、薄膜トラン 10 ジスタのドレイン電極およびソース電極を介して映像信 号線からの映像信号が供給されるITO膜からなる画素 電極を備えたものであって、

前記画素電極のソース電極に対する接続は、該画素電極の下層に形成された保護膜に設けられたコンタクト孔を 通してなされている液晶表示装置において、

少なくとも前記ソース電極は、CrあるいはCrを主成 分とする合金膜とITO膜との順次積層からなる積層膜 で形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】 映像信号線、薄膜トランジスタのドレイ 20 ン電極およびソース電極は、それぞれ同一の材料からなり、CrあるいはCrを主成分とする合金膜とITO膜との順次積層からなる積層膜で形成されていることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係 り、たとえばアクティブ・マトリックス方式と称される 液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】アクティブ・マトリックス方式の液晶表示装置は、液晶を介して互いに対向配置される透明基板のうち一方の透明基板の液晶側の面に、x方向に延在しy方向に並設される走査信号線とこれら走査信号線に絶縁されy方向に延在しx方向に並設される映像信号線とで囲まれる各領域によって画素領域を構成している。

【0003】そして、それぞれの画素領域には、走査信号線からの走査信号の供給によってオンされる薄膜トランジスタと、このオンされた薄膜トランジスタを介して映像信号線からの映像信号が供給される透明のITO膜 40からなる画素電極とが形成されている。

【0004】このような液晶表示装置は、透明基板の表面の全域に形成した材料層を周知のフォトリソグラフィ技術による選択エッチングすることによって所定のパターンに形成する工程を数回繰返すことによって形成される各種材料の多層構造からなっている。

【0005】このため、最下層以外の材料層を除く他の 材料層はその下層に形成された材料層の段差部を股ぐよ うにして形成され、たとえばこの材料層が信号線の場合 にはその段差部の傾所で断切れが生じてしまう場合があ る。

【0006】この場合の対策の一つとして、たとえば、 パターン化された材料層の外輪郭における側壁に透明基 板側に未広がり状となるテーパを形成することによっ て、急後な段差部が形成されるのを防止する構造のもの が知られている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このようなテーパを形成することは、そのための工程を特に必要として工程数の増加を招いたり、また、工程数の増加はないがたとえば本来的な機能を若干損なう覚悟で特別の材料を選定しなければならないというような不都合が指摘されていた。

【0008】本発明は、このような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、信号線として適当な材料を選択できるともに、極めて工程が簡単にも拘らず該信号線にテーパが形成された液晶表示装置を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 下記のとおりである。

【0010】すなわち、液晶を介して互いに対向配置される透明基板のうち少なくともその一方の透明基板の液晶側の面に、各画素を駆動させるための信号線が形成されている液晶表示装置において、CrあるいはこのCrを主成分とする合金膜とITO膜との積層膜で形成された信号線が備えられていることを特徴とするものである。

30 【0011】このように構成された液晶表示装置は、その信号線としてCrあるいはこのCrを主成分とする合金膜で形成され、それ自体は液晶表示装置の信号線としてたとえば抵抗値等を勘案して適当な材料とされる。 【0012】そして、この合金層の上面にITO膜を形

【0012】そして、この合金層の上面にTTO限を形成して、フォトリソグラフィ技術による選択エッチングをする場合のエッチング液としてはCrのエッチング液を用いるのみで所定のパターンを形成できるようになる。

【0013】この場合、所定のパターンに形成された信 切 号線は、その健壁面において、透明基板側に末広がり状 となるテーパが自動的に形成されるようになる。

【0014】このことから、信号線として適当な材料を 選択できるともに、工程が極めて簡単にも拘らず該信号 線にテーパを形成することができるようになる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置 の一実施例を図面を用いて説明をする。

【0016】〔実施例I〕

全体の機略構成

にはその段差部の個所で断切れが生じてしまう場合があ 50 図2に示すように、まず、矩形状の透明ガラス基板1が

ある。この透明ガラス基板1はいわゆるTFT基板と称 されるもので、液晶を介していわゆるフィルタ基板と対 向配置されるようになっている。

【0017】前記透明ガラス基板1の液晶側の面には、 図中x方向に延在しy方向に並設される複数の走査信号 線 (ゲート信号線) 2が形成され、これら各走査信号線 2と絶縁されて図中y方向に延在しx方向に並設される 複数の映像信号線(ドレイン信号線)3が形成されてい

【0018】これら走査信号線2と映像信号線3とで囲 10 まれる矩形状の各領域はそれぞれ画素領域(図中点線枠 Aで示す)を構成し、この画素領域のそれぞれには、そ の領域の大部分を占めるようにして透明の画素電極が形 成され、この画素電極の周辺に薄膜トランジスタおよび 付加容量素子が形成されている。なお、この画素領域に おける詳細な構成は後に詳述する。

【0019】そして、これら各画素領域の集合によって 表示領域 (図中点線枠Bで示す) が形成され、前記走査 信号線2のそれぞれの一端側(図中左側)はこの表示領 域を越え透明ガラス基板1の一辺部にまで延在されて形 20 成されている。

【0020】また、この透明ガラス基板1の一辺部にま で延在された走査信号線2は、その部分において線幅が 大きく形成されることによってゲート端子部2Aが備え られている。このゲート端子部2Aは外付け部品となる 図示しない走査駆動回路と接続される個所となってい

【0021】さらに、映像信号線3においても、それぞ れの一端側(図中上側)は前記表示領域を越え透明ガラ して、この透明ガラス基板1の一辺部にまで延在された 映像信号線3は、その部分において線幅が大きく形成さ れることによってドレイン端子部3Aが備えられてい る。 このドレイン端子部3Aは外付け部品となる図示し ない映像駆動回路と接続される個所となっている。

【0022】そして、このように構成されるTFT基板 には、フィルタ基板がその外輪郭を図中一点鎖線Cの部 分に位置づけられるようにして対向配置され、走査信号 線2のゲート端子部2Aおよび映像信号線3のドレイン 端子部3Aのそれぞれは該フィルタ基板から露呈される ようになっている。前記走査駆動回路および映像駆動回 路との接続を容易にできるためである。

【0023】TFT基板とフィルタ基板は図中一点鎖線 の部分においてスペーサを兼ねるシール材が介在される ことによって互いに固着され、該TFT基板とフィルタ 基板との間に介在される液晶を封止するようになってい

【0024】なお、フィルタ基板は、その液晶側の面に おいて、各画素領域に共通に透明な共通電極が形成され ているとともに、対応する画素領域にはR(赤)、G

(緑)、B(赤)のうちのいずれかのカラーフィルタが たとえば樹脂材によって形成されている。

【0025】画素領域の構成

図3は、前記走査信号線と映像信号線とで囲まれる画素 領域の構成を示す平面図である。なお、図中I-I線にお ける断面図を図1に、VI-VI線における断面図を図4 に、V-V線における断面図を図5に示す。

【0026】まず、図3において、図中x方向に延在し y方向に並設される走査信号線2が形成されている。こ の走査信号線2は、Al-Ti-Taの合金層2aで構 成され、その表面は陽極化成されてA12O3の酸化膜2 bが形成されている(図1参照).この酸化膜2bは走 査信号線2中に含まれるA1によるいわゆるヒロックの 発生を防止するとともに、後述の映像信号線3に対する 層間絶縁を強化する等のために設けられている。

【0027】そして、この走査信号線2上の一部(図中 **画素領域の右上)は、薄膜トランジスタTFTの形成領** 域となっており、この部分にSiN膜5aとa-Si膜 5bとが順次積層された積層膜5が形成されている。

【0028】この場合、積層膜5は走査信号線2に対す る映像信号線3との交差部分にも延在されて形成され、 この延在部は該映像信号線3に対する層間絶縁を強化で きるようになっている。

【0029】前記積層膜5の上面に形成されたa-Si 膜5bにドレイン電極3Dおよびソース電極3Sを形成 することにより、走査信号線2の一部をゲート電極と し、その表面に形成された酸化膜(A12O3)2bをゲ ート絶縁膜とするMIS型のトラジスタが形成されるこ とになるが、該ドレイン電極3Dおよびソース電極3S ス基板1の一辺部にまで延在されて形成されている。そ 30 はそれぞれ映像信号線3の形成と同時に形成されるよう になっている (なお、薄膜トランジスタTFTのドレイ ン、ソースは本来その間のバイアス極性によって決定さ れるが、この明細書では、画素電極に接続される側の電 極をソース電極として、他方をドレイン電極と定義す る)。

> 【0030】すなわち、図中y方向に延在しx方向に並 設される映像信号線3が形成されている。この映像信号 線3の走査信号線2に対する交差部には、上述したよう にSiN膜5aとa-Si層5bとからなる積層膜5が 形成され、また、走査信号線2の表面には酸化膜2bが 形成されていることから、これら信号線の層間絶縁に関 して高い信頼性を持たせることができるのは上述した通 りである。

【0031】そして、この映像信号線3から延在されて ドレイン電極3Dが一体に形成され、また、このドレイ ン電極3Dと離間されてソース電極3Sが形成されてい

【0032】この場合、ソース電極38は画素領域の一 部にまで延在されて形成され、この延在部は後述する画 50 素電極8とのコンタクトを図る端子部3Tとなってい

れている。

る。

【0033】映像信号線3、ドレイン電極3D、および ソース電極3Sは、この実施例では、特に、それぞれC rとMoとの合金膜3aとITO膜3bとを順次積層さ せた積層膜から構成されている。

【0034】この場合、映像信号線3、ドレイン電極3 D、およびソース電極3Sは、フォトリソグラフィ技術 による選択エッチングの際のエッチング液として、Cr のとMoとの合金膜3bのエッチング液(硝酸第二セリ ウムアンモニウムを用いるのみで、所定のパターンに形 10 成することができる。すなわち、ITO膜3bのエッチ ング液、およびCrとMoとの合金膜3aの各エッチン グ液をそれぞれ順次使用する必要がないという効果を奏

【0035】そして、フォトリソグラフィ技術による選 択エッチングは、そのマスクとしてフォトレジスト膜を 用いることは周知であるが、このフォトレジスト膜はI TO膜に対して極めて密着性が良好なことから、該映像 信号線3、ドレイン電極3D、およびソース電極3Sの 加工を精度よくできる効果を奏する。

【0036】また、前記積層膜の選択エッチングは、上 層のITO膜3bが後退しながらエッチングされること が確かめられ、その下層のCrとMoとの合金膜3a は、図1に示すように、その側壁面が透明基板1側に末 広がり状のテーパを形成するようにエッチングされるよ うになる。

【0037】 このことは、 図1に示すように、 たとえば 前記積層膜からなるソース電極3D(正確にはその端子 部3T)を保護膜7を介して乗り越える画素電極8の段 差部における断切れの防止を図ることができる効果を奏 30 に延在されて形成されている。 する。

【0038】さらに、CrとMoとの合金膜3aとIT O膜3bとの順次積層からなる積層膜は、それ自体断切 れに対して冗長性を有することが確認されている。

【0039】なお、薄膜トランジスタTFTのソース電 極3Sおよびドレイン電極3Dはその下層のa-Si層 5bとの間で、該a-Si層5bの表面にドーピングさ れた高濃度のn型不純物層5cを介することによってオ ーミック接続が図れるように構成されている。

【0040】この場合のn型不純物層5cは、a-Si 40 層5 b の形成の段階でその表面の全域に形成されてお り、ソース電極3Sおよびドレイン電極3Dを形成した 後にこれら各電極自体をマスクとしてこれら各電極から 露呈されている不要なn型不純物層5cをエッチングす ることによりa-Si層5bと各電極3S、3Dとの間 にのみ残存させることができる。

【0041】このように加工された表面には、その全域 にわたってSiN膜からなる保護膜7が形成されてい る。この保護膜7は薄膜トランジスタTFTの液晶に対 FTの特性の劣化を防止することを主たる目的で形成さ

【0042】また、この保護膜7は、その一部におい て、薄膜トランジスタTFTのソース電極3Sの端子部 3Tの一部を露呈させるためのコンタクト孔7Aが形成 され、このコンタクト孔7Aを通して該ソース電極3S と次に述べる画素電極8との接続が図れるようになって

【0043】ここで、この保護膜7は、該コンタクト孔 7Aの側壁面にテーパ(透明ガラス基板1側に末広がり となるテーパ)が形成されるように、図示はしていない がエッチングレートの遅いSiN膜とエッチングレート の速いSiN膜の順次積層からなる積層体からなってい

【0044】そして、この保護膜7の上面には、各画素 領域毎に独立した画素電極8が形成されている。この画 素電極8はITO膜から構成され、上述したように前記 コンタクト孔7Aを通して保護膜7下の薄膜トランジス タTFTのソース電極3Sとの接続が図れるようになっ 20 ている。

【0045】この場合、ソース電極3D(正確にはその 端子部3T)は、その側壁面にテーパが形成されている ことから、保護膜7を介してこのソース電極3Sを保護 膜7を介して乗り越える画素電極8の段差部における断 切れの防止を図ることができる効果を奏することは上述 した通りである。

【0046】また、この画素電極8は、前記薄膜トラン ジスタTFTのゲート電極を兼ねる走査信号線2とは異 なる他の隣接する走査信号線2の一部に重畳できるよう

【0047】この延在部によって、画素電極8と前記他 の隣接する走査信号線2との間には付加容量素子Cad dが形成され、この付加容量素子Caddは該走査信号 線2の表面に形成された酸化膜(Al2O3)とその上面 の保護膜7を誘電体膜とするものである。

【0048】この付加容量素子Caddは、薄膜トラン ジスタTFTがオフした際に、画素電極8に供給された 映像信号を長く蓄積させておく等のために設けられてい る。

【0049】この場合の画素電極8は、映像信号線3と 保護膜7を介して形成していることから、該映像信号線 3との接触を憂えることなく大きな面積で形成すること ができるようになる。このため、いわゆる各画素領域の 開口率を向上させることができるようになる。

【0050】なお、図示していないが、このように加工 された表面には、その全域にわたって配向膜が形成さ れ、この配向膜と直接に接触して配置される液晶の配向 を規制できるようになっている。

【0051】 ゲート端子部の構成

する直接の接触を回避しこれにより薄膜トランジスタT 50 図6は、前記ゲート端子部2Aの一実施例を示す構成図

であり、同図(a)は平面図、同図(b)は同図(a)のb-b線における断面図である。

【0052】まず、透明ガラス基板1面において、走査信号線2から延在されて形成される端子部は、その材料自体であるAl-Ti-Taの合金層2aからなり、その表面に陽極化成による酸化膜(Al2O3)2bが形成されていないものとなっている。

【0053】そして、この端子部を充分覆うようにして CrとMoとの合金膜3aとITO膜3bとの順次積層 からなる積層膜3'が形成されている。この積層膜3' は、画素領域における映像信号線3の形成の際に、同一 の材料で同時に形成されるようになっている。

【0054】さらに、この端子部には、その一部にまで 画素領域における保護膜7が延在されて形成され、この 保護膜7から露呈された前記積層膜3'の上にこの積層 膜3'を充分に覆うようにしてITO膜8'が形成され ている。このITO膜8'は画素電極8の形成と同時に 形成されるようになっている。

【0055】ITO膜8'は比較的硬質の材料からなり、このITO膜8'に直接に接続される走査駆動回路 20 の端子による押圧に充分に耐え得るように構成されている

【0056】また、このITO膜8'は、上層にITO 膜3bが形成されたCrとMoとの合金膜3aを下地層 として形成されていることから、接触抵抗の低減が図れ 信頼性ある端子部を構成することができるようになる。 このことは、ソース電極3Sの端子部3Tにおいても同 じである。

【0057】ドレイン端子部の構成

図7は、前記ドレイン端子部3Aの一実施例を示す構成 30 図であり、同図(a)は平面図、同図(b)は同図 (a)のb-b線における断面図である。

【0058】まず、透明ガラス基板1面において、映像信号線3が延在されて形成される端子部は、その材料自体であるCrとMoとの合金膜3aとITO膜3bとの順次積層からなる積層膜からなっている。

【0059】そして、この端子部には、その一部にまで 画素領域における保護膜7が延在されて形成され、この 保護膜7から露呈された前記積層膜の上にこの積層膜を 充分に覆うようにしてITO膜8'が形成されている。 このITO膜8'は画素電極8の形成と同時に形成され るようになっている。

【0060】このITO膜8'は、上層にITO膜3bが形成されたCrとMoとの合金膜3aを下地層として形成されていることから、接触抵抗の低減が図れ信頼性ある端子部を構成することができるようになる。

【0061】製造方法

上述した構成からなる液晶表示装置の製造方法の一実施 例を図8を用いて説明する。

【0062】工程1.(図8(a))

透明ガラス基板1を用意し、この透明ガラス基板の表面の全域にたとえばスパッタリング方法によりAl-Ti-Taの合金層2aを厚さ300nmに形成する。

【0063】その後、フォトリソグラフィ技術による選択エッチングを行うことにより、同図に示すパターンで 走査信号線2を形成する。

【0064】工程2. (図8(b))

走査信号線2を陽極化成することにより、その表面に酸化膜(Al₂O₃)2bを形成する。

) 【0065】この場合、酸化膜2bの厚さは約175n m程度とし、これにより、この酸化膜によって被われる A1-Ti-Taの合金層2aの厚さが約175nm程 度とすることが望ましい。

【0066】工程3. (図8(c))

このように加工された透明ガラス基板1の表面に、たとえばプラズマCVD方法により、SiN層、i型のa-Si層、高濃度のn型のa-Si層を、それぞれ約220nm、約200nm、約30nmの厚さで順次形成する

【0067】その後、フォトリソグラフィ技術による選択エッチングを行うことにより、同図に示すパターンからなる積層体5を形成する。この積層体はそれぞれ同一パターンのSiN膜5a、i型のa-Si層5b、高濃度のn型のa-Si層5cからなっている。

【0068】工程4. (図8(d))

このように加工された透明ガラス基板1の表面の全域に、たとえばスパッタリング方法により、CrとMoとの合金層、ITO膜を、それぞれ約200nm、約100nmの厚さで順次形成する。

) 【0069】その後、フォトリソグラフィ技術による選 択エッチングを行うことにより、同図に示すパターンか らなる映像信号線3、ドレイン電極3D、ソース電極3 Sを形成する。

【0070】この場合の選択エッチングの際のエッチング液としては、CrのとMoとの合金膜3bエッチング液(硝酸第二セリウムアンモニウム)を用いるのみで、所定のパターンに形成することができる。特に、ITO膜3bのエッチング液、およびCrとMoとの合金膜3aの各エッチング液をそれぞれ順次使用する必要がなく40なる。

【0071】工程5. (図8(e))

このように加工された透明ガラス基板1の表面の全域 に、たとえばスパッタリング方法により、SiN膜を厚 さ約300nmで形成する。

【0072】その後、フォトリソグラフィ技術による選択エッチングを行うことにより、SiN膜にソース電極3Sの端子部3Tの一部を露呈させるコンタクト孔7Aを形成し、同図に示すパターンからなる保護膜7を形成する。

50 【0073】工程6. (図8(f))

このように加工された透明ガラス基板1の表面の全域 に、たとえばスパッタリング方法により、ITO膜を厚 さ約140 nmで形成する。

【0074】その後、フォトリソグラフィ技術による選 択エッチングを行うことにより、同図に示すパターンか らなる画素電極8を形成する。

【0075】〔実施例II〕図9は、本発明による液晶表 示装置の他の実施例を示す画素領域の平面図である。

【0076】図3と対応する図であり、同一の機能を有 する部分には同一の符号を付している。

【0077】図3と異なる部分は保護膜に形成するコン タクト孔7Aの位置にある。 図3においては、薄膜トラ ンジスタTFTのソース電極3Sの端子部3Tの略中央 部を露呈させるようにしてコンタクト孔7Aを設けたも のであるが、この実施例では、前記端子部3Tの一辺部 が露呈するようにして設けられている。

【0078】これにより、図9のX-X線における断面図 である図10に示すように、画素電極8は、透明ガラス 基板1に直接接触している保護膜7A上を延在した後 に、前記コンタクト孔7Aにおいて、ソース電極3Sと 20 接続され、さらに保護膜8を乗り越えるようにして延在 されて形成される。

【0079】 ここで、特徴的な構造して、画素電極8は 透明ガラス基板1に直接接触している保護膜7Aの段差 部を股いでソース電極3Sと接続されることにある。そ の理由は、透明ガラス基板1に直接接触してる保護膜7 Aは、その界面において安定化が図れてることから、保 護膜7Aのコンタクト孔7Aの側壁面におけるテーパを 所望通りに形成でき、この部分の段差を股がる画素電極 8に断切れが生じることがないという効果を奏する。

【0080】ちなみに、保護膜8の下層にITO膜等の 他の金属層が存在する場合、該金属層との接着の安定性 が図れない場合があり、これが原因で該保護膜8のコン タクト孔7Aの内壁面に所定通りのテーパが形成されな い場合(いわゆる逆テーパが形成される場合がある)が あるからである。

【0081】なお、図9においては、実施例 I と異な り、映像信号線3が形成される部分に、SiN膜5aと a-Si膜5bとの積層体5が形成されている構成とな っている。

【0082】このようにすることにより、映像信号線3 が段差を股がない構成とするとともに、その下層の金属 層がMoを含まないCrのみとした場合に、そのストレ スによる弊害を除去することができるからである。

10

【0083】上述した実施例では、映像信号線3、ドレ イン電極3D、およびソース電極3Sは、その下層の金 属としてCrとMoの合金層を用いたものである。しか し、これに限定されることはなく、Moを含まないCr のみの金属層であってもよい。同様の効果を奏するから

【0084】また、上述した実施例では、走査信号線2 は、その材料としてAIを用いその表面を陽極酸化した ものである。しかし、これに限定されることはなく、映 10 像信号線3等と同様に、CrとMoの合金層とITO膜 との順次積層からなる積層膜、あるいはCェ層とITO 膜との順次積層からなる積層膜で形成してもよいことは いうまでもない。

[0085]

【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、 本発明による液晶表示装置によれば、信号線として適当 な材料を選択できるともに、極めて工程が簡単にも拘ら ず該信号線にテーパが形成されたものを得ることができ るようになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す構 成図であり、図3のI-I線における断面図を示す。

【図2】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す全 体概略構成図である。

【図3】本発明による液晶表示装置の画素領域の構成の 一実施例を示す平面図である。

【図4】図3のVI-VI線における断面図である。

【図5】図3のV-V線における断面図である。

【図6】本発明による液晶表示装置のゲート端子部の一 30 実施例を示す構成図である。

【図7】本発明による液晶表示装置のドレイン端子部の 一実施例を示す構成図である。

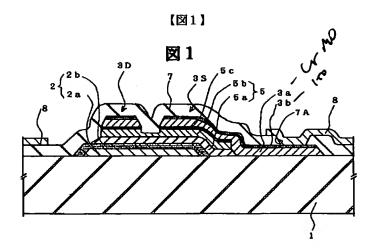
【図8】本発明による液晶表示装置の製造方法の一実施 例を示す工程図である。

【図9】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す 平面図である。

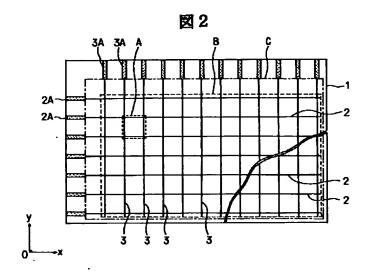
【図10】図9のX-X線における断面図である。

【符号の説明】

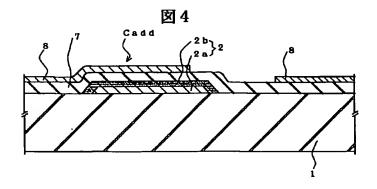
1…透明ガラス基板、2…走査信号線、2A…ゲート端 子部、3…映像信号線、3A…ドレイン端子部、3a… CrとMoの合金層、3b…ITO膜、3D…ドレイン 電極、3S…ソース電極、7…保護膜、8…画素電極、 TFT…薄膜トランジスタ、Cadd…付加容量素子。



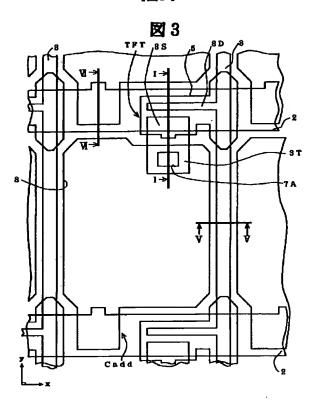
【図2】



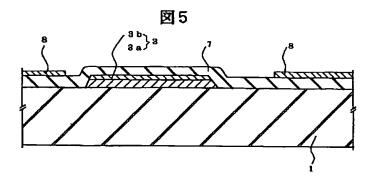
【図4】



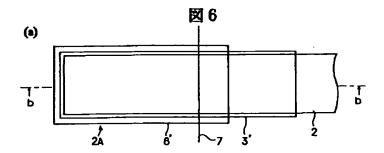
【図3】

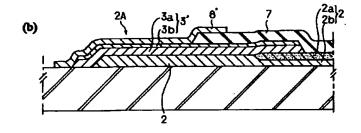


【図5】

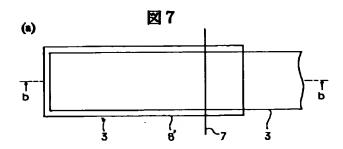


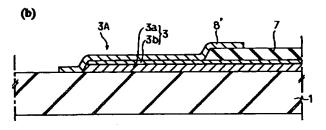


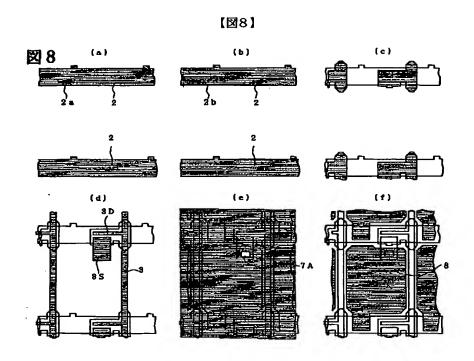


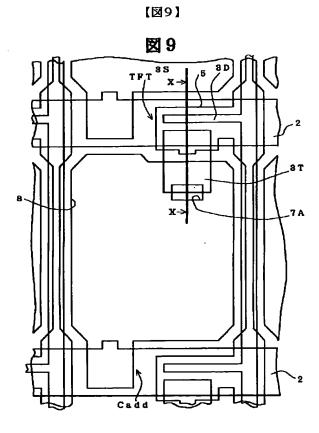


【図7】

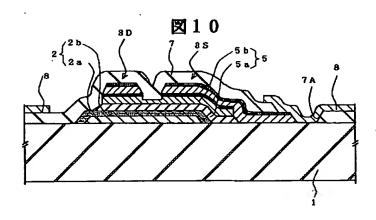








【図10】



【手続補正書】

【提出日】平成10年2月16日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】変更

【補正内容】

【0034】この場合、映像信号線3、ドレイン電極3 D、およびソース電極3 Sは、フォトリソグラフィ技術による選択エッチングの際のエッチング液として、C r のとMoとの合金膜3 bのエッチング液 (硝酸第二セリウムアンモニウム系混合液) を用いるのみで、所定のパターンに形成することができる。すなわち、I TO膜3 bのエッチング液、およびC r とMoとの合金膜3 aの各エッチング液をそれぞれ順次使用する必要がないという効果を奏する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0070

【補正方法】変更

【補正内容】

【0070】この場合の選択エッチングの際のエッチング液としては、CrのとMoとの合金膜3bエッチング液(硝酸第二セリウムアンモニウム<u>系混合液</u>)を用いるのみで、所定のパターンに形成することができる。特に、ITO膜3bのエッチング液、およびCrとMoとの合金膜3aの各エッチング液をそれぞれ順次使用する必要がなくなる。

【手続補正3】

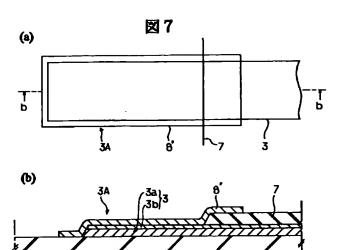
【補正対象書類名】図面

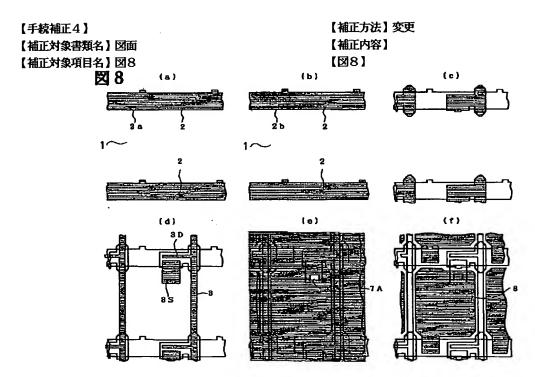
【補正対象項目名】図7

【補正方法】変更

【補正内容】

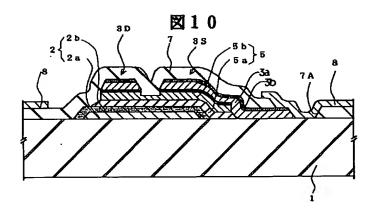
【図7】





【手続補正5】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図10

【補正方法】変更 【補正内容】 【図10】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

HO1L 29/78

616V

(72)発明者 金子 寿輝 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 天野 智 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 高野 隆男 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 大原 和博 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 島倉 剛毅 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 肥田 宏之

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 安生 健二 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 有吉 知幸 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 合田 貴博 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 堀井 寿一 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内